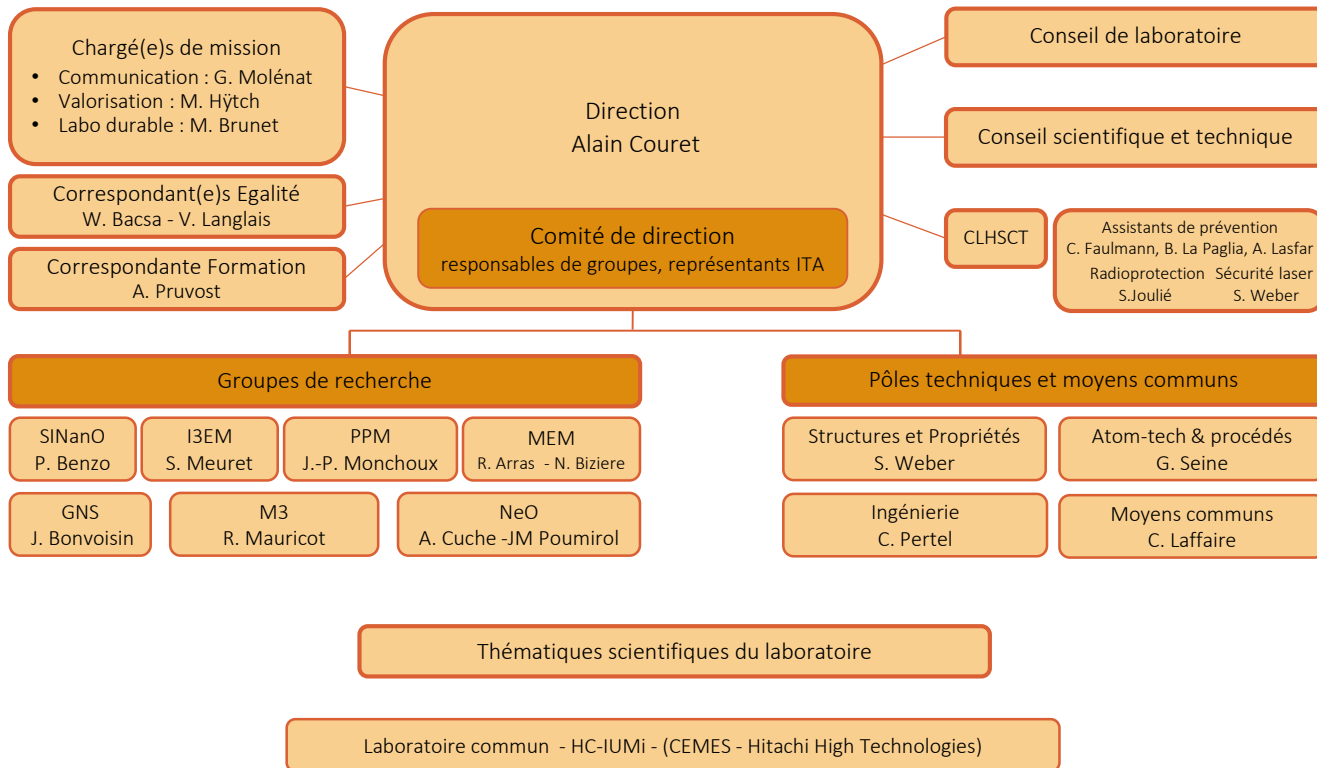


CEMES

UPR8011



Pôle Atome Tech et Procédés

Animateur : G. Seine (IGRCN)

Nanofabrication et Nanocaractérisation

Resp. : J. Harmel (IRCN)

N. Bréfuel (IECN, 10%)

C. Deshayes (AI, 50%)

S. Pinaud (AI)

L. Noé (AI)

G. Seine (IGRCN, 25%)

Croissance et Implantation Ionique

Resp. : G. Seine (IGRCN, 50%)

S. Barre (IECN)

F. Neumayer (IGEHC, 40%)

Synthèse chimique

Resp. : N. Bréfuel (IECN, 40%)

Ultra-vide et Cryogénie

Resp. : J. Faria (IECN)

Pôle Structures et Propriétés

Animateur : S. Weber (IRCN)

MET, FIB et préparation échantillons

Resp. : C. Marcelot (IRCN)

R. Cours (IECN)

C. Crestou (TCE)

F. Houdellier (IRHC, 10%)

S. Joulié (IEHC)

D. Lamirault (TCS)

Optique et magnétisme

Resp. : S. Weber (IRCN, 75%)

S. Moyano (IGEEN)

F. Neumayer (IGEHC, 60%)

Caractérisation

Resp. : D. Neumeyer (IECN)

C. Deshayes (AI, 20%)

Pôle Ingénierie

Animateur : C. Pertel (IRHC)

Mécanique

Resp. : P. Abeilhau (IRCN)

B. Gatti (AI)

C. Thenot (IGE)

Electronique

Resp. : C. Pertel (IRHC)

A. Lasfar (IRCN)

Pôle Moyens Communs

Animatrice : C. Laffaire (IEHC)

Administration - Gestion

Resp. : A. Pruvost (IECN)

F. Cardeilhac (AI)

R.M. Tauzin-Melendo (AI)

M. Trupin (TCE)

C. Viala (IGEEN)

Infrastructure

Resp. : P. Paiva (IEHC)

B. La Paglia (AI)

A. Gourri (Apprenti)

Informatique - Réseaux

Resp. : C. Hillebrand (IRCN)

O. Bancelhon (IEHC)

C. Laffaire (IEHC)

L. Pettiti (IGEEN)

PPM

**Physique de la
Plasticité
et Métallurgie**
(13 C/EC)

J.P. Monchoux (CR)

M. Brunet (CR)

A. Couret (DR)

J. Douin (DR)

C. Faulmann (DR)

M. Hantcherli (MdC)

V. Langlais (CR)

M. Legros (DR)

G. Molénat (MdC)

F. Mompiau (CR)

F. Pettinari (Pr)

H. Schaal (MdC)

P. Sciau (DR)

C. Deshayes (AI, 30%)

D. Caillard (DR émérite)

L. Durand (MC émérite)

M3

**Matériaux
Multi-échelles
Multifonctionnels**
(5 C/EC)

R. Mauricot (MdC)

W. Bacsá (Pr)

P. Puech (MdC)

V. Serin (Pr)

M. Verelst (Pr)

M. Monthieux (DR émérite)

MEM

**Matériaux et dispositifs
pour l'Electronique et le
Magnétisme**
(8 C/EC)

R. Arras (CR)

N. Biziere (CR)

A. Bernand-Mantel (CR)

J.F. Bobo (DR)

L. Calmels (Pr)

N. Cherkashin (DR)

A. Claverie (DR)

D. Li (CR)

NeO

**Nano-Optique et
Nanomatériaux pour
l'Optique**
(9 C/EC)

A. Cuche (CR)

J.M. Poumirol (CR)

G. Agez (Mdc)

C. Bonafos (DR)

M. Carrada (CR)

J. Groenen (Pr)

H.Lourenço-Martins (CR)

V. Paillard (Pr)

R. Péchou (Mdc)

G. Seine (IGRCN, 25%)

S. Weber (IRCIN, 25%)

R. Carles (Pr émérite)

I3EM

**Interférométrie, In situ et
Instrumentation pour la
Microscopie Electronique**
(6 C/EC)

S. Meuret (CR)

P.F. Fazzini (Mdc)

C. Gatel (Mdc)

M. Hÿtch (DR)

E. Snoeck (DR)

B. Warot-Fonrose (DR)

F. Houdellier (IRHC, 40%)

SINanO

**Surfaces,
Interfaces et Nano-
Objets**
(9 C/EC)

M. Benoît (DR)

P. Benzo (Mdc)

N. Combe (Pr)

R. Coratger (Pr)

F. Demangeot (Mdc)

A. Ponchet (DR)

M. Respaud (Pr)

H. Tang (CR)

N. Tarrat (CR)

M.J. Casanove (DR émérite)

GNS

**Groupe
NanoSciences**
(7 C/EC)

J. Bonvoisin (CR)

X. Bouju (DR)

O. Guillermet (Mdc)

C. Kammerer (Mdc)

V. Magné (CR)

D. Martrou (CR)

G. Rapenne (Pr)

N. Bréfuel (IECN, 50%)

C. Joachim (DR émérite)

J.P. Launay (Pr émérite)